Мартон А.¹, Голомб Р.¹, Міца В.^{*1}, Вереш М.³, Боркач Є.², Ріго І.¹ Раман спектри та порівняльний аналіз структури стекол розрізів As₂S₃-GeS₂, As₂S₃-Ge₂S₃, As₂S₃-GeS

¹Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна ²Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегово, Україна ³ Цент фізичних досліджень Вігнера Угорської академії наук, м. Будапешт, Угорщина

Анотація. Приведені дослідження Раман спектрів стекол розрізів As_2S_3 -GeS₂, As_2S_3 -Ge₂S₃, As_2S_3 -GeS та з використанням першопринципних розрахунків проведена їх структурна інтерпретація.

Kлючові слова: Раман спектри, халькогенідні стекла, розрізи As_2S_3 - GeS_2 , As_2S_3 - Ge_2S_3 , As_2S_3 -GeS, структура стекол

Вступ. Проблема структуроутворення некристалічних твердих тіл є фундаментальною в фізиці твердого тіла [1]. Обширна область склоутворення в потрійній системі Ge-As-S допускає неперервну зміну оптичних параметрів, що важливо при пошуку складів з суцільноув'язаною матрицею структури для створення променевостійких елементів оптики потужних лазерів, нелінійної та інтегральної оптики видимого та ІЧ діапазону, оптичних покрить і плівкових поляризаторів [1-3]. В той же час дослідження локальної координації атомів в складних стеклах на сьогодні є не чисельними, що пов'язане як з експериментальними, так і з теоретичними складнощами їх вивчення та опису. Ускладнення складу обмежує об'єм структурних даних, що одержують дифракційним методами, і тому на перший план досліджень по схемі складструктура-дисперсність-властивості виступає метод Раман спектроскопії. Метою даної роботи є дослідження Раман спектрів потрійних стекол системи Ge-As-S та їх структурної інтерпретації.

Методики досліджень. Синтез склоподібних матеріалів системи Ge-As-S здійснювався із елементарних компонент чистоти "ОСЧ" В-5 в кварцевих ампулах. Вихідні компоненти зважувались з точністю до 10-7 кг і насипались у відпалені кварцеві ампули, які попередньо оброблялись концентрованою азотною кислотою і промивались дистильованою водою. Наповнені шихтою ампули за допомогою газокисневого пальника прогрівалась до температури 400-450 К для усунення парів води і запаювались під вакуумом порядку 10^{-4} торр. Синтез стекол $As_x S_{100-x}$ проводився повільним нагріванням в трубчастій електричній печі до температури 900 °С та загартовуванням на повітрі до кімнатної температури. Всі зразки відпалювались з метою вилучення залишкових напруг, які виникають в них при загартуванні. Процес синтезу германійвмістних потрійних стекол, був дещо складнішим. Спочатку ампула з шихтою нагрівалась з швидкістю 250 К/год до температури 800 К і витримувалась в такому стані протягом 5 годин. Це дозволило зменшити тиск парів сірки у ампулах і запобігти їх розриву в процесі синтезу. Потім температура синтезу підвищувалась до 1200 К з швидкістю порядку 100 К/год. Розплав при цій температурі витримувався протягом 10 год, а потім охолоджувався з швидкістю 1.5*10² К/с (охолодження у воді). Отримані зразки були однорідними і не містили включень кристалічної фази.

* corresponding author, e-mail: v.mitsa@gmail.com

Для вимірювань високороздільних Раман спектрів використовувався Bruker IFS-66 інтерферометр з ССД-детектором приєднаний до Bruker FRA 106 Раман модуля. В якості джерела збудження використовувався Nd: YAG лазер з потужністю більше 500 мВт і довжиною хвилі λ_{36} =1064 нм (E₃₆=1.17 eB). При дослідженнях Раман спектрівстекол вихідна потужність лазерного випромінювання складала 90 мВт. Вимірювання проводились при кімнатній температурі з використанням 180° конфігурації. Роздільна здатність спектрометра складала ~1 см⁻¹. Для вимірювання мікро-Раман в стеклах використовувались також система Renishaw System 1000. Для збудження розсіювання в цьому випадку використовувався діодний лазер з довжиною хвилі λ_{361} =785 нм., (відповідна енергія фотонів Е_{зб1}=1.58 eB).

З метою підвищення достовірності інтерпретації експериментальних даних, та для розуміння процесів, які відбуваються в халькогенідах при опроміненні, в роботі було використано серію першопринципних розрахунків таких характеристик кластерів (фрагментів структури) як оптимальна геометрія, частоти коливань (включаючи Раман-активності), стабільність, енергія утворення, значення енергетичної щілини тощо. Для розрахунків в основному використовувались такі пакети квантово-механічних програм як GAMESS (US) [4] та GAUSSIAN-03 [5]. В якості базисних наборів при розрахунках використовувались як відомі, так і модифіковані нами базисні набори.

Результати та їх обговорення. На рис. 1. представлені спектри Раман спектри скло-подібного с-As40S60(As2S3), зняті при різних довжинах хвиль лазерного збудження. Порівняння цих спектрів дає можливість виявити відмінності, які виникають в спектрах при збудженні Раман-сигналу різними енергіями фотонів. Вони наступні: 1) змінюється ширина смуг та їх положення; 2) відбувається перерозподіл інтенсивоності смуг; 3) в спектрах знятих при *E*₃₆≥2.41 eB помітно проявляється смуга біля 700 см-¹. В [3] була розглянута модель наногетероморфного склоутворення, згідно якої матрицю структури склоподібного дисульфіду германію можна розглядати як сукупність кластерів, що являють собою фрагменти всіх відомих в системі кристалів. Так, в системі As-S відомі молекулярні кристали низькотемпературної і високотемпературної фаз As₂S₃, відповідно орпімента та анорпімента, узоніту As₄S₅, диморфіту (d- As₄S₃) та різні модифікації As₄S₄ [1-3,6].



Рис. 1. Залежність Раман спектрів *с*-Аs₄₀S₆₀ (As₂S₃) від довжини хвилі лазерного збудження

- 1) λ_{зб.1}=1064 нм;
- λ_{3б.2}=785 нм; 3) λ_{3б.3}=632.8 нм;
- λ_{3б.4}=514.5 нм;
- 5) λ_{36.5}=488 нм; 6) Раман спектр полікристалічного аурипігменту As₂S₃.



Рис. 2. Раман спектри полікристалічного аурипігменту As₂S₃ (1) та склоподібного As₂S₃ (2) та розрахований спектр кластеру орпімента As₆S₁₂: (3) – інтегральний спектр; (4) – спектр з окремих гаусіан.



Рис. 3. Фрагменти кристалічної структури низькотемпературної (орпімента) та високотемпературної фаз (анорпімента) трисульфіду миш'яку (As₂S₃) [6].

Розпочнемо структурну інтерпретацію Раман спектру спектрі стехіометричного складу с-As₄₀S₆₀ (с-As₂S₃), знятого при $\lambda_{36,1}$ =1064 нм (рис. 1, крива 1), в рамках найпростішого молекулярного наближення. Це наближення дає можливість зробити висновок, що складна смуга в Раман спектрі с-Аs₄₀S₆₀ з максимумом при 340 см⁻¹ та перегином при 311 см⁻¹ відповідає симетричним та асиметричним валентним коливанням пірамід AsS₃ (рис. 1, крива 1) [2]. Розрахунки коливного спектру в рамках кластерного наближення приведені на рис.2, де зроблено порівняння розрахованого Раман спектру 12-членного кільця орпімента (рис. 3), сформованого із пірамід AsS₃ (кластер As₆S₁₂), типового як для анорпімента так і для кристалічного орпімента As₂S₃, з експериментальними Раман спектрами полікристалічного орпімента та склоподібного As₂S₃. Як видно, розрахований теоретично інтегральний спектр кластеру As₆S₁₂ (рис. 2, крива 3) добре відтворює експериментальний спектр полікристалічного зразка окрім одного важливого виключення: положення основних смуг в полікристалічному зразку орпімента спостерігається при 310 і 355 см⁻¹, тоді як розрахованому інтегральному смуги спостерігаються при 334 і 344 см⁻¹. Відмітимо, що смуга при 330 см⁻¹ є найбільш інтенсивною в Раман спектрі недавно відкритого кристалу анорпіменту [6]. Аналіз співіснування в матриці структури с-Аs₄₀S₆₀ кластерів анорпіменту і орпіменту потребує подальшого вивчення, результати якого будуть приведені в наступних роботах.

Зосередимось далі на виявлених в Раман спектрі с-Аѕ40S60, (рис. 1) слабоінтенсивних смуг при 187, та перегину при 360 см⁻¹ та смуги при 222 см⁻¹ 233 см⁻¹. Поєднання приведених в табл. 1 розрахованих даних частот коливань молекул реальгару та парареальгару спільно з аналізом Раман спектру (рис. 1) вказує на те, що в матриці структури c-As₄₀S₆₀ присутня невелика кількість нанофазних включень молекул реальгару β-As₄S₄ і парапеальгару р- As₄S₄. Із зростанням енергії збудження Раман сигналу виявлено ряд ефектів вказаних вище, пов'язаних з можливою модифікацією молекул As₄S₄. Оскільки зміни в Раман спектрах пов'язані в основному в області коливань кластерів As₄S₄ (див. табл. 1), то для пояснення процесів, які відбуваються, при опроміненні лазерним випромінюванням слід проводити аналіз коливних спектрів кристалічних модифікацій As₄S₄. Якщо β- і α- As₄S₄ кристалічні модифікації реальгару відрізняються тільки упаковкою однотипних молекул As₄S₄ в кристалічну гратку, то в парареальгарі відмінною є також локальна структура молекул As₄S₄ [2].



Частотний зсув, см-1

Рис. 4. Раман спектри стекол розрізу (As₂S₃)_x(GeS₂)_{100-x} ($\lambda_{36,2}$ =785 нм)

Таблиця 1. Частоти коливань (ν), інтенсивності КРС (I^{KPC}), силові постійні (f) КР-активних ($I^{KPC}>3$ Å⁴/а.о.м.) валентних та деформаційних мод $\alpha(\beta)$ -Аs₄S₄ і p-Аs₄S₄, розраховані метолом DFT (B3L ХР/6-311 G*).

<i>V</i> , CM ⁻¹	<i>I^{КРС}</i> , Å ⁴ /а.о.м.	<i>f</i> , мДін/Å	Віднесення	
$\alpha(\beta)$ -As ₄ S ₄				
171/181*	7.1	1.2	$v_{n\phi}(As-As)$	
$178 / 188^{*}$	15.7	1.2	$v_{\varphi}(As-As)$	
219	3.2	1.7	δ(S-As-S)	
220	10.5	2.0	δ(As-S-As)	
228	4.1	1.1	δ(S-As-S)	
347	13.7	2.8	$v_{E+A}(S-As-S)$	
362	43.9	2.8	$v_A(S-As-S)$	
$p-As_4S_4$				
174	10.5	0.8	δ(S-As-S)	
186	5.5	0.8	δ(S-As-S)	
207	6.4	1.5	δ(As-S-As)	
218/228*	10.9	1.9	v _A (As-As-As)	
222/232*	3.4	2.0	$v_{\rm E}({\rm As-As-As})$	
240	6.9	2.1	δ(As-S-As)	
315	3.6	2.2	$v(As-S)+v_A(S-As-S)$	
331	4.3	2.5	$v_{\rm E}(S-As-S)$	
336	19.8	2.4	$v_A(As-S)$	
347	33.0	2.6	$v_A(As-S-As)$	

 δ , v, A, E, ϕ і n ϕ – деформаційні і валентні, симетричні, несиметричні, фазні, протифазні коливання відповідно; * – кореговані частоти As-As коливань

Тому перерозподіл інтенсивностей в області валентних коливань As-As (табл. 1) відображає трансформацію $\alpha(\beta)$ -As₄S₄ $\rightarrow p$ -As₄S₄ (рис. 1, криві 2-5): зменшення інтенсивностей смуг при 187 і 220 см-(характерних для $\alpha(\beta)$ -As₄S₄) супроводжується одночасним зростанням інтенсивностей смуг при ~230-239 см⁻¹ (характерних для p-As₄S₄). Крім того, зрозумілими є і зміни в області валентних коливань As-S: зменшення інтенсивності дублету 342 i 362 см⁻¹ $(\alpha,\beta-As_4S_4)$ супроводжується зміщенням цих піків до ~330-336 і 349 см⁻¹ (*p*-As₄S₄). Таким чином, щоб уникнути поліморфних перетворень реальгар-парареальгар при зменшенні довжини хвилі збуджуючого випромінювання від $\lambda_{36.1}$ =1064 нм; $\lambda_{36.2}$ =785 нм; λ_{36,3}=632.8 нм; λ_{36,4}=514.5 нм; до λ_{36,5}=488 нм при дослідженні Раман спектрів потрійних стекол системи Ge-As-S з можливими нанофазними включеннями, нам потрібно було вибрати джерела збудження Раман сигналу як мінімум в інфрачервоній області випромінювання – $\lambda_{36,1}$ =1064 нм; $\lambda_{36,2}$ =785 нм.

Як видно з рис. 4, для стекол розрізу As_2S_3 -GeS₂ максимуми, характерні для с-GeS₂, починають проявлятися в Раман спектрах починають проявлятися в Раман спектрах стекол, що містять не менше 40 мол. % GeS₂(рис. 4., крива 3). В Раман спектрі складу (As_2S_3)₆₀(GeS₂)₄₀, крім найбільш інтенсивної смуги при 340 см⁻¹, спостерігається перегин біля 375 см⁻¹ і виникає новий максимум біля 435 см⁻¹.

В рамках кластерної моделі будови стекол максимуми при 375 см⁻¹ і 435 см⁻¹ можна віднести до коливань чотирьохчленних кілець із тетраедрів GeS_{4/2}, зв'язаних ребрами [7]. Смуги при 375 і 435 см⁻¹ однаково підсилюються в резонансних спектрах КР при використанні в якості джерела збудження аргонового лазера з λ= 480 нм [8,9]. Для стекол (As₂S₃)_x(GeS₂)_{100-x} при 100≤х≥60 слабоінтенсивні смуги в області 190-300 см⁻¹ можна розглядати як результат накладання смуг, що зумовлені коливаннями атомів в нанофазних включеннях β -As₄S₄ при 187, 222 см⁻¹ та парареальгару р - As_4S_4 біля 200 та 230 см⁻¹ (див. табл. 1). Із зростанням відношення до Ge/S=0,5 в потрійних стеклах при 0≤х≥40 в області 200-300 см-1 проявляється слабоінтенсивна складна смуга з максимумом біля 250 см⁻¹. Для збільшення достовірності її віднесення розглянемо як впливає інтенсивність цієї смуги при збільшенні відношення Ge/S=0,66 в склоподібному с-Ge₂S₃ (рис. 5).

Одночасно з ростом смуги при 250 см⁻¹ в Раман спектрі с-Ge₂S₃ зростає інтенсивность коливань біля 400 см⁻¹. Цей одночасний ріст інтенсивностей обох смуг можна зв'язати з появою в структурі скла "дефектних" 5-и членних кільцевих кластерів, коливання Ge-Ge зв'язків яких, чітко проявляються при 255 і 400 см-1 .В ранніх роботах такі коливання були віднесені до "етаноподібних" молекул, що з'являються в матриці структури стекол системи Ge-S при відношенні Ge/S>0,5 [1]. В порівнянні з с-GeS₂ (Ge/S=0,5) з подальшим зростанням відношення Ge/S в с-Ge₂S₃ (Ge/S=0,66) відбувається деполімерізація шаруватих кластерів шляхом відщеплення від 6-тичленних кілець 4-членних Ge₂S_{2+4/2}, на що вказує зменшення інтенсивності коливань біля 370 і 430 см⁻¹ (рис. 5. крива 3).



Рис. 5. Раман спектри Ge_2S_3 , $GeS_2(T_2V_2)$ та диференційний спектр $\{I_RGe_2S_3-I_RGeS_2(T_2V_2)\}$



Рис. 6. Структура кластерів сульфіду германію (X=S) [10]

Можливість утворення ланцюгів із 4-член-них кілець $Ge_2S_{2+4/2}$ деполімеризації ілюструє рис. 6. Кінцеві атоми сірки з подвійними зв'язками Ge=S в розрахованому коливальному спектрі кластерів Ge_nS_m, приведених на рис. 6, мають частоти коливань, що лежать від 500 до 550 см⁻¹ [10].

Як видно з рис. 5, в експериментальному спектрі як с-GeS₂ так і с-Ge₂S₃ в цьому інтервалі дійсно присутні слабоінтенсивні коливання. Подібне частотне положення мають коливання кінцевих атомів As=S в гроноподібних кластерах As_nS_m, що вже експериментально виявлено в Раман спектрі с-As₂S₃, загартованого від 500°С [11]. Про утворення одиночних S-S зв'язків в дефектних кільцевих кластерах Ge₃S_{5+4/2} (S-S) свідчить слабо інтенсивна смуга при 492 см⁻¹ (рис. 4). Подібно до нанофазних включень реальгару та парареальгару в с-Аs₂S₃, ідентифікованих по даним аналізу Раман спектру (рис. 1), в різницевому спектрі стекол Ge_2S_3 та GeS_2 { $I_RGe_2S_3$ - $I_RGeS_2(T_2V_2)$ } (рис. 5.) в тій же спектральній області як і в Раман спектрі с-As₂S₃ (рис. 1) чітко появляється складна смуга з максимумом при 231 см⁻¹, характерна для коливань атомів в кластерах на основі пірамід SGe_{3/3} з потрійно координованою сіркою по германію. Другий максимум коливань кластерів на основі SGe_{3/3} в розрахованому і експериментальному різницевому спектрі {I_RGe₂S₃- $I_RGeS_2(T_2V_2)$ проявляється при 246 см⁻¹ (рис. 5, крива 3). Тобто складна смуга в Раман спектрі с-Ge₂S₃ в області коливань від 200 до 280 см⁻¹ (рис. 5) може виникати внаслідок накладання частот коливань дефектних 5-и членних кільцевих кластерів з Ge-Ge зв'язками при 250 см⁻¹ і коливань кластерів з потрійною координацією Ge при 200, 230 і 246 см⁻¹, характерних для кристалічного моносульфіду германію [1].

Порівнюючи їх інтенсивність в Раман спектрах с-GeS₂ та с-Ge₂S₃ (рис.5) можна сказати, що в матриці структури с-Ge₂S₃ формуються нанофазні включення Ge₃S_{5+4/2} (Ge-Ge) і SGe₃-S_{6/3}, вміст яких перевершує їх вміст в с-GeS₂. Аналогічно до виявлених раніше [12] нанофазних включень вільного Ge в плівках на основі с-Ge₂S₃, нами виявлений перегин біля 300 см⁻¹ в різницевому спектрі $\{I_RGe_2S_3-I_RGeS_2(T_2V_2)\}$ (рис. 5) розміщений в області частот, де проявляються коливання аморфного германію a-Ge [1]. Це дає підставу говорити про наявність також і в склі с-Ge₂S₃ нанофазних включень вільного германію. Таким чином порівняльний аналіз Раман спектрів с-GeS2 і с-Ge2S3 вказує на те, що збільшення відношення Ge/S в останньому приводить до формування структури с-Ge₂S₃ шестичленними кільцями Ge₃S_{3+6/2}, чотирьохчленними кільцями $Ge_2S_{2+4/2}$, дефектними п'ятичленними кільцями Ge₃S_{5+4/2} (S-S), Ge₃S_{5+4/2} (Ge-Ge), SGe₃-S_{6/3} та кластерами на основі с.о.Ge_{4/4}.

Розглянемо далі еволюцію Раман спектрів розрізу $(Ge_2S_3)_x$ (As₂S₃)_{100-х} (рис. 6). Положення основних смуг в Раман спектрі скла цього розрізу з х=80 подібне до положення смуг в с-Ge₂S₃ (рис. 5), структурна інтерпретація коливних смуг якого проведена вище. Для x=60 в Раман спектрі стекол $(Ge_2S_3)_x$ $(As_2S_3)_{100-x}$ чітко проявляються смуга при 270 см-1, яка є однією із найбільш інтенсивних смуг в Раман спектрі кристалічного As₄S₃[8], сформованого замкнутими кластерами As₄S₃, розрахунки коливань якого представлені в табл. 2. В області 180- 240 см⁻¹ в Раман спектрі цього скла з'являються смуги, характерні для реальгару та парареальгару (рис. 7). Смуга при 340 см⁻¹ скла з x=60 вказує на присутність в мА-триці структури кілець $Ge_3S_{3+6/2}$, а смуги з максимумом біля 250 і 400 см⁻¹ – на наявність кілець Ge₃S_{5+4/2} (Ge-Ge).







Рис. 8. Раман спектр стекол розрізу (As₂S₃)_x(GeS)_{100-x} ($\lambda_{36,2}$ =785 нм)

З ростом х від x=60 до x=10, інтенсивність смуги при 270 см⁻¹ зменшується, а інтенсивність коливань характерних для p-As₄S₄ та r-As₄S₄ до x=20 залишається значною. Одночасно з ростом х відповідно зменшенням відношення Ge/S в потрійних стеклах, зменшується інтенсивність коливань в області 400-450 см⁻¹, що свідчить про зменшення долі в матриці структури стекол шестичленних кілець Ge₃S_{3+6/2} та п'ятичленних кілець Ge₃S_{5+4/2} (Ge-Ge). При наближенні до с-As₂S₃ (x=10) Раман спектр потрійного скла подібний до Раман спектру бінарного с-As₂S₃ (рис. 1).

При збільшенні відношення Ge/S=1 для крайнього члену (GeS) розрізу (As₂S₃)_x(GeS)_{100-x}, Раман спектр скла при х=90 (рис. 8) подібний до Раман спектру скла розрізу $(Ge_2S_3)_x(As_2S_3)_{100-x}$ при аналогічному вмісті As₂S₃ (рис. 7). Тобто для потрійних стекол обох розрізів, близьких до As₂S₃ структра є подібною. Із зростанням х домінуючою в області 180-300 см⁻¹ є складна смуга з максимумом 218 см⁻¹, на високочастотному крилі якої помітною є добре розділена смуга при 232 см⁻¹, а на низькочастотному крилі чітко видно дві смуги при 187 і 208 см-1. Найбільш інтенсивні із смуг при 218 та 232 см⁻¹ є характерними для коливань зв'язків As-As в молекулах реальгару та парареальгару відповідно (табл. 1). При 90_≤x_≤60 інтенсивність максимуму при 218 см⁻¹ зростає, що супроводжується роздвоєнням найбільш інтенсивного максимуму при 340 см⁻¹ і виникненням чіткої смуги при 361 см⁻¹. Ріст обох смуг чітко свідчить про зростання в матриці структури потрійних стекол нанофазних включень, характерних для β-Аs₄S₄. При 50≤x≤40 iнтенсивність смуг, характерних для коливань атомів в β-As₄S₄ зменшується і в Раман спектрі в області 180-300 см⁻¹ починає домінувати коливна мода при 270 см⁻¹, характерна для коливань зв'язків As-As в As_4S_3 (табл. 2), інтенсивність якої неперервно зростала починаючи з x=70. Ріст інтенсивності при 270 см⁻¹ супроводжується зсувом коливної моди від 340 см⁻¹ (х=60) до 350 см⁻¹, тобто в бік розміщення коливань валентних зв'язків As-S в As₄S₃ (табл. 2).

Таблиця 2. Частоти ν (см⁻¹) та Раман-інтенсивності I^{Paman} (Å⁴/a.o.м.) коливань кластеру As₄S₃, розраховані метолом DFT/Stuttgart RLC ECP (nd).

Кластер	<i>v,см</i> ⁻¹	І ^{Раман}
A_4S_3	180	4.2
	187	7.7
	198	6.8
	201	7.0
	228	8.4
	271	28.4
	327	4.6
	329	4.5
	357	21.1
	368	2.0
	369	2.3

Висновки. При відхиленні складу потрійних стекол від складу стекол псевдобінарного розрізу As_2S_3 -GeS₂ і збільшенні відношення Ge/S від 0,5 (GeS₂) до 0,66 (Ge₂S₃) і до 1.0 (GeS) в крайніх членах розрізів As_2S_3 -GeS₂, As_2S_3 -Ge₂S₃, As_2S_3 -GeS відповідно, в матриці структури потрійних стекол As_2S_3 -Ge₂S₃, As_2S_3 -GeS з ростом Ge/S в області проміжних складів наростає виділення нанофаз реальгару, парареальгару (As₄S₄) та диморфіту (As₄S₃). При зростанні відношення Ge/S в стеклах (As₂S₃)_x(GeS)_{100-x} при x=45 домінує виділення нанокластерів диморфіту As₄S₃. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, II(4), Issue: 32, 2014 www.seanewdim.con

REFERENCES (TRANCELATED END TRANCELITERATED)

1. Fekeshgazi I., May K., Mitsa V., Vakaruk A. Physics and Applications of Non-Crystalline Semiconductors in Optoelectronics / edited by A. Andriesh, and M. Bertolotti, Kluwer Academic Publishers, NATO ASI Series 3, High Technology., – 1997 – Vol. 36. 243 p.

2. Mitsa V., Holomb R., Veres M., Koós M.. Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben. Hungarian Academy of Sciences .Budapest: Intermix Kiadó, – 2009. – 104 p.

3. Mitsa V., Holomb R., Veres M., Marton A., Rosola I., Fekeshgazi I., Koós M.. Non-linear optical properties and structure of wide band gap non-crystalline semiconductors. // *Phys. Stat. Sol. C.* 2011. – Vol.8, N:9. – P. 2696-2700.

4. Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., Jensen J.H., Koseki S., Matsunaga N., Nguyen K.A., Su S., Windus T.L., Dupuis M., Montgomery J.A. General Atomic and Molecular Electronic Structure System // J. Comput. Chem. – 1993. – Vol.14. – P. 1347-1363.

5. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria G.E., Robb M.A., Cheeseman J.R., Montgomery J.A.Jr., Vreven T., Kudin K.N., Burant J.C., Millam J.M., Iyengar S.S., Tomasi J., Barone V., Mennucci B., Cossi M., Scalmani G., Rega N., Petersson G. A., Nakatsuji H., Hada M., Ehara M., Toyota K., et al. Gaussian 03, Revision B.05. – Pittsburgh PA.: Gaussian, Inc. – 2003.

6. Kampf A.R., Downs R.T., Housley R.M, Jenkins R., Hyrs'l J. / Anorpiment, As_2S_3 , the triclinic dimorph of orpiment // Mineralogical Magazine. – 2011. – Vol. 75(6) – P. 2857-2867.

7. Mitsa V., Golomb R., Lovas G., Veresh M., Borkach E., Kovacs T., Rigo I./ Effect of fragments of low-and high-temperature

Мартон А., Голомб Р., Міца В., Вереш М., Боркач Є., Ріго І.

Раман спектры и сравнительный анализ структуры стекол розрезов As₂S₃-GeS₂, As₂S₃-Ge₂S₃, As₂S₃-GeS

Аннотация. Приведены исследования Раман спектров стекол разрезов As_2S_3 -GeS₂, As_2S_3 -GeS₃, As_2S_3 -GeS и с использованием первопринципных расчетов проведена их структурная интерпретация

Ключевые слова: Раман спектры; халькогенидные стекла; разрезы As₂S₃-GeS₂, As₂S₃-Ge₂S₃-GeS; структура стекол

MartonA., Golomb R., Mitsa V., Veresh M., Borkach E., Rigo J.

Raman spectra and comparative analysis of the glass structure of the systems As_2S_3 -GeS₂, As_2S_3 -GeS₃, As_2S_3 -GeS Annotation . There was investigated Raman spectra of glasses along line As_2S_3 -GeS₂, As_2S_3 -GeS₃, As_2S_3 -GeS and done their structural interpretation.

Keywords: Raman spectra; chalcogenide glasses; line As₂S₃-GeS₂, As₂S₃-Ge₂S₃, As₂S₃-GeS; glassy structure

crystalline phases in germanium disulfide formation of mixed middle order in the technologically modified glassy c-GeS2: difference Raman spectra and first principle calculations (Ukrainian) // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, I(2), Issue: 15, – 2013. P. 62-66.

8. Holomb R., Mitsa V., Johansson P., Mateleshko N., Matic A., Veresh M. Energy-dependence of light-induced changes in g-As₄₅S₅₅ during recording the micro-Raman spectra // Chalcogenide Letters – 2005. – Vol. 2, No.7. – pp. 63-69.

9. Holomb R., Mateleshko N., Mitsa V., Johansson P., Matic A., Veres M. New evidence of light-induced structural changes detected in As-S glasses by photon energy dependent Raman spectroscopy // J. Non-Cryst. Sol. – 2006. – Vol. 352. – P. 1607-1611.

10. Fejes I. Billes F. /Investigation of the structural units of germanium sulfide and selenide by quantum chemical methods//

J. Quantum Chemistry.- 2001. -Vol. 85. -Pp. 85-91 .

11. Shpotyuk O., Kozyukhin S., Shpotyuk Ya., Demchenko P., Mitsa V., Veres M. / Coordination disordering in near-stoichiometric arsenic sulfide glass// Journal of Non-Crystalline Solids .-2014.- Vol. 402. – P. 236–243.

12. Gamulin O., Ivanda M., Mitsa V. , Spectroscopy studies of structural phase transitions of chalcogenide glass thin films Ge_2S_3 - As_2S_3 at coordination number 2.67// Solid State Communication. - 2005. - Vol.135 (11-12). -P.753-758.

13. Gamulina O., Ivanda M.,Mitsa V.,Balarina M.Kosović M. /Monitoring structural phase transition of $(Ge_2S_3)_x(As_2S_3)_{1-x}$ chalcogenide glass with Raman spectroscopy// Journal of Molecular Structure. -2011.-Vol. 993, Issues 1–3.-Pp. 264–268.